# レーザー核融合高速点火方式における 抵抗性磁場による電子ビームガイディング特性の数値解析 Simulation of Electron Beam Guiding by Resistivity Magnetic Field in Fast Ignition Laser Fusion

春日井貴英<sup>1</sup>, 城崎知至<sup>1</sup>, 長友英夫<sup>2</sup>, 羽原英明<sup>3</sup>, 住岡耕平<sup>3</sup>, 牧山大暉<sup>3</sup>, Tao Gong<sup>4</sup>, 西野信博<sup>1</sup> Kasugai Takahide<sup>1</sup>, Johzaki Tomoyuki<sup>1</sup>, Nagatomo Hideo<sup>2</sup>, Habara Hideaki<sup>3</sup>, Sumioka Kouhei<sup>3</sup>

et al.

<sup>1</sup>広大院工,<sup>2</sup>阪大レーザー研,<sup>3</sup>阪大院工,<sup>4</sup>中国工程物理研 <sup>1</sup>Hiroshima Univ, <sup>2</sup>ILE Osaka Univ, <sup>3</sup>Osaka Univ, <sup>4</sup>CAEP

## 1. 緒言

高速点火レーザー核融合において,高強度レ ーザー照射によって生成される高速電子ビー ムの発散を抑えてコアプラズマまでガイドす る方法として,物質境界の抵抗率勾配に起因し て生じる抵抗性磁場を用いる方法がある[1]. 2017年の阪大レーザー研GXII+LFEXシステム を用いた,高抵抗率材としてNiを挿入したオレ イン酸中実模擬燃料球の爆縮・加熱実験におい て,爆縮プラズマからの高速電子起因のCu-Kα 光イメージ像より,抵抗性磁場による高速電子 の収束性が示唆された.

本研究では、高速電子が生成する臨界密度近 傍に注目し、抵抗性磁場による電子ビームガイ ディングの有効性を評価する.更により効果的 にガイドできるデザインについて検討を行う.

#### 2. 計算条件

衝突電離過程を含む二次元PICコード[2]を使 用した.図1(a),(b)に初期密度分布を示す.オ レイン酸をCH<sub>2</sub>で模擬し,中心部に厚さ8µmの Niを配置した(図1(a)).図1(b)は一次元(x方向)の 電子密度分布である.y方向には電子密度は一 様とした.計算領域左側に厚さ5µmの真空領域 を置き,そこから電子密度n<sub>e</sub>を0.1n<sub>cr</sub>(n<sub>cr</sub>:レーザ ー臨界密度)から10n<sub>cr</sub>まで指数関数(スケール長 4µm)で増加させ,それ以降は一定値10n<sub>cr</sub>とした. 左側境界からレーザー(強度10<sup>19</sup>W/cm<sup>2</sup>,波長 1.053µm,パルス長457fs)を入射した.

## 3. 結果

Niを挿入した場合とCH<sub>2</sub>のみの場合における 抵抗性磁場や電子の輸送効率を比較した.図 1(c),(d)に521fsにおけるz方向の静磁場の二次元 強度分布を示す.Niを挿入した場合(図1(c)), NiとCH<sub>2</sub>の境界面に10kTの磁場が生成された. x=45μmに観測点を設置し, y=20~32 μmの幅 を左から右に通過する高速電子のエネルギー を時間積分し、レーザーの入射エネルギーとの 比で輸送効率を評価した.Niを挿入した場合, 抵抗性磁場ガイド効果により、Ni無しの場合に 比べて輸送効率は23%向上した.



図1 計算条件と結果. (a)Niの初期位置, (b)電 子密度初期分布, (c), (d)521fsにおけるz方向の 静磁場B分布で, (c)はNi有り, (d)はNi無しの場合.

#### 4. 結言

二次元PICシミュレーションにより,臨界密度 近傍(10n<sub>cr</sub>)でのNiによる抵抗性磁場ガイド効果 を評価した.NiとCH<sub>2</sub>の境界には10kTの磁場が 生成し,この磁場によるガイド効果でNiを挿入 した場合は輸送効率が23%向上した.この結果 より,10n<sub>cr</sub>程度の低密度領域でもガイディング 効果が期待できることが示された.講演では, より効果的なデザインについて議論する.

## 参考文献

- [1] B. Ramakrsishna et al. Phys. Rev. Lett. 105.135001 (2010)
- [2] Y. Sentoku and A. J. Kemp, J. Comput. Phys. 227. 6846 (2008)